

## TESCAN 扫描电镜 TIMA3 LM

TESCAN 集成式矿物分析仪 (TIMA) 是一款新型的自动矿物分析的扫描电子显微镜, 适用于采矿和矿物加工行业。TIMA 可以对块状、薄片或抛光切片样品进行自动矿产丰度分析、粒度解离分析、矿物组合分析和颗粒尺寸分析。

TIMA 的应用范围很宽, 包括矿石性质、工艺优化、修复、贵金属和稀土的寻找等。TESCAN 的独特技术是基于一个完全集成的 EDX 系统执行快速的全光谱扫描。SEM 与 EDX 硬件的一体化技术提供了前所未有的数据采集速度, 进而得到快速、准确和可靠的结果。



## TIMA 的优点

全自动数据采集过程很快

TIMA 系统基于 MIRA 或者 VEGA SEM 平台

特殊 VEGA 镜筒设计使灯丝的使用寿命更长

新设计的样品台集成了 BSE/EDX 校准标准与法拉第杯

我们可以根据客户要求更改能放入样品的大小

最多 4 个集成式 EDX 探测器确保最高的性能

新 Peltier 冷却的 EDX 探头保持热稳定性

数据分析过程又快又可靠

根据样品的每个部分可变扫描时间与 EDX 分析时间

TIMA 软件有两个版本, 可满足不同需求

各种各样的数据分析模块

可定制的分类规则

性价比高

可定制的解决方案

## TIMA 硬件

TESCAN TIMA 基于 MIRA 肖特基场发射或者 VEGA 钨灯丝扫描电子显微镜。MIRA 镜筒的特殊设计（电子枪的恒真空与隔绝阀）提高了发射的稳定性和钨灯丝的使用寿命。该系统提供高真空模式为标准，低真空模式为选配。

大样品室、由计算机控制的超快样品台、矿物样品支持器的特殊设计。样品台可以同时容纳 7 块直径最大为 30mm 的样品。样品台内可放入直径 25 mm 至 32 mm 的样品。样品台有 EDX/BSE 校准标准、铂 Faraday 筒（BSE 信号校准）与锰、铜、石英、碳和金元素（系统性能检查）。标准校准的元素可以根据客户要求定制。

## 标配

分析&测量

柱状图

图像处理

3 维扫描

硬度测量

多图像校准

对象区域

定时关机

公差测量

定位

Live Video

EasySEM™

## 配件

二次电子探头

背散射电子探头

探针电流测量

压差式防碰撞报警装置

可观察样品室内部的红外线摄像头等，各种配件可供选择

上海百贺仪器科技有限公司

SHANGHAI BAHENS INSTRUMENTS CO., LTD.

规格外观如有变更，恕不另行通知



Tel.: 021-3358 7030 Fax.: 021-3358 9826

Service call: 400-099-6011

Http://www.bahens.com